

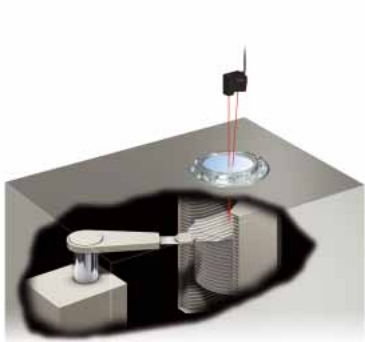
GUÍA RÁPIDA PARA LA MEJORA DE PROCESOS

KAIZEN

SEMICONDUCTORES

1 Verificación de la posición de una oblea a través de una ventana

La Serie LK-G puede detectar establemente obleas a través de una ventana sin una configuración complicada.

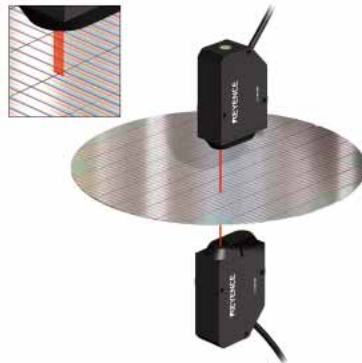


Sensor de desplazamiento láser CCD

Serie LK-G

2 Medición del grosor de obleas

La Serie LT-9000 garantiza mediciones confiables sin verse afectada por los patrones de superficie, gracias a su método de barrido doble de alta precisión.

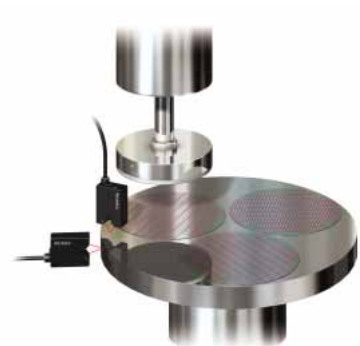


Medidor de desplazamiento confocal de barrido láser de superficie

Serie LT-9000

3 Posicionamiento de un portador

La Serie LK-G inspecciona portadores en rotación para evitar el posicionamiento defectuoso debido a un ajuste inapropiado.



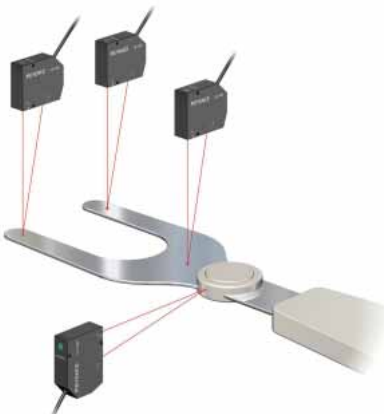
Sensor de desplazamiento láser CCD

Serie LK-G

SEMICONDUCTORES

4 Detección de desalineación en un brazo transportador

Si un brazo transportador está mal alineado, las obleas no pueden ser transportadas o puestas de manera segura, por lo que la oblea se puede dañar. La Serie LK-G se utiliza para monitorear constantemente la posición del brazo.

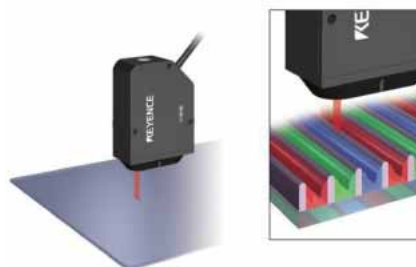


Sensor de desplazamiento láser CCD

Serie LK-G

5 Medición de la forma de las costillas de pantallas planas

La Serie LK-G se utiliza para medir la forma de las costillas y verificar las variaciones de éstas, para mejorar la calidad de las pantallas.

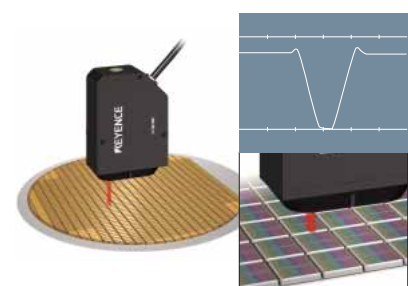


Sensor de desplazamiento láser CCD

Serie LK-G

6 Medición de la profundidad de las hendiduras entre dados

El punto de medición de 2µm hace posible la toma de medidas confiable de la forma y profundidad de pequeñas hendiduras.



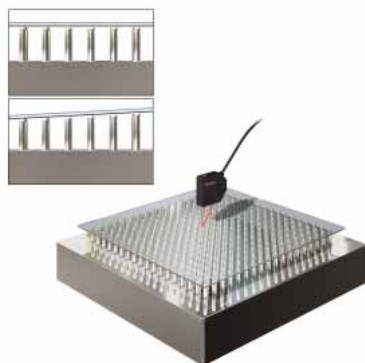
Medidor de desplazamiento confocal de barrido láser de superficie

Serie LT-9000

Pantallas Planas

7 Medición de la altura de pines

La Serie LK-G escanea una placa de vidrio ubicada sobre los pines para verificar si éstos tienen la misma altura. Esto reduce considerablemente el tiempo necesario para los ajustes.

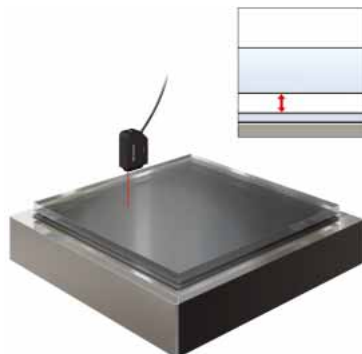


Sensor de desplazamiento láser CCD

Serie LK-G

8 Medición de separación entre una máscara y una placa de vidrio

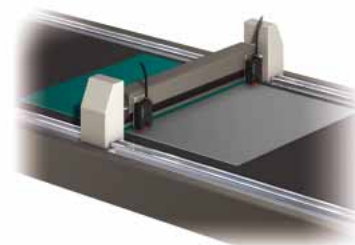
La Serie LT-9000 puede medir la separación entre una máscara y una placa de vidrio, mediante la detección de diferentes intensidades de luz reflejadas por ambos lados de las dos placas.



Medidor de desplazamiento confocal de barrido láser de superficie Serie LT-9000

9 Medición de la separación de una recubridora paralela

La Serie LK-G ajusta la separación de una recubridora paralela para controlar la cantidad de la aplicación.



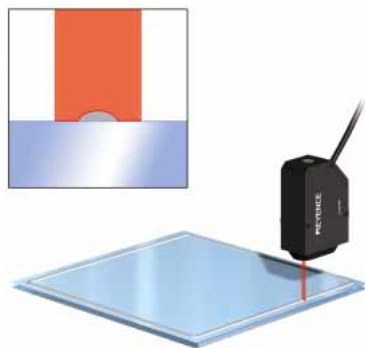
Sensor de desplazamiento láser CCD

Serie LK-G

Pantallas Planas

10 Detección de la forma del material sellador

La Serie LT-9000 puede medir los perfiles de objetos mojados y calcular el área de corte transversal utilizando la función de medición de área.



Medidor de desplazamiento confocal de barrido láser de superficie Serie LT-9000

11 Detección de despostilladuras en un sustrato de cristal líquido

La Serie LS-7000 proporciona una detección a alta velocidad y confiable de despostilladuras y otros defectos, en sustratos transparentes para lograr una inspección en línea del 100%.

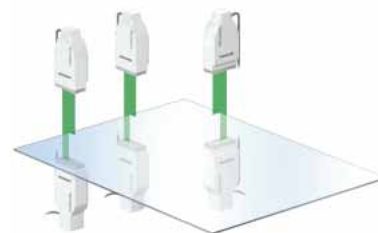


Micrómetro CCD

Serie LS-7000

12 Posicionamiento de placas de vidrio

El recién desarrollado sistema óptico permite un posicionamiento de alta precisión de sustrato de vidrio transparente.



Micrómetro CCD

Serie LS-7000

Presentamos lo Último en Medición Láser Sin Contacto

EL MÁS VELOZ
EN CLASE

392kHz

ULTRA ALTA PRECISIÓN

±0.02% a P.E.

MÁXIMA REPETIBILIDAD EN SU CLASE

0.0004 Mil (0.01 μm)



TASA DE MUESTREO DE 392kHz

El recién desarrollo CCD Linearizado brinda mediciones ultra rápidas, para todo tipo de objetos desde hule negro hasta superficies tipo espejo.



Objetos ejemplo:

Llanta

Engrane

Herramienta ATC

Ventilador

REFLEXIONES MÚLTIPLES

Utilizando el algoritmo MRC*, se pueden medir con gran precisión superficies metálicas de perfil complejo.

*MRC:
Cancelación de Reflexiones Múltiples



Objetos ejemplo:

Rueda

Válvula

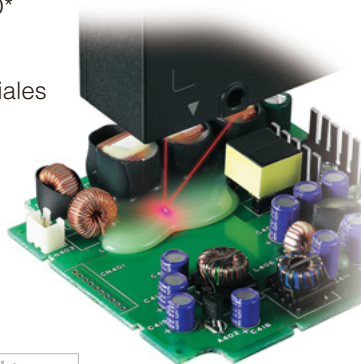
Rodamiento

Árbol de levas

OBJETOS TRASLÚCIDOS

Se emplea el algoritmo RPD* para la medición exacta de objetos translucidos, tales como plástico y materiales porosos.

*RPD: Detección de Picos Reales



Objetos ejemplo:

Circuito impreso

Pieza plástica

OBJETOS TRANSPARENTES

Control multifuncional para la medición de vidrio, utilizado en la producción de LCDs o PDPs.



Objetos ejemplo:

Silicón

Pieza plástica

Cubierta plástica

Vidrio

KEYENCE

CONTACTARNOS AL
(81) 8220-7900

www.keyence.com.mx
E-mail : keyencemexico@keyence.com



AVISO DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente el manual de instrucciones para operar de manera segura cualquier producto KEYENCE.

KEYENCE MÉXICO S.A. DE C.V.

Corporativo Mariano Escobedo 476 Piso 1, Col. Nueva Anzures, México, D.F. CP 11590, México Teléfono (81)8220-7900 Fax (81)8220-9097

OFICINAS LOCALES

San Pedro Garza García, Nuevo León

Ciudad Juárez, Chihuahua

León, Guanajuato

Tijuana, Baja California

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku, Osaka, 533-8555, Japan Teléfono +81-6-6379-2211

La información publicada en este documento se basa en evaluaciones e investigaciones hechas por KEYENCE al momento del lanzamiento del producto y puede cambiar sin previo aviso.
Copyright (c) 2009 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved. MeasureKaizenSemi-KMX-EN0526-MX 1102-2 [673022] Printed in Japan

KMX1-1072

